



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME LC88FC2F0BUTJ
 RMS O47287 and O49812 PACKAGE
 TQFP 100

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/ 48 x3
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/48 x3
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/77 x3
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	NA	NA
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77 x3
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C		0/170 x3
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/10 x3
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15 x3

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Part Number	Qualification Vehicle
LC88FC2F0BUTJ-2H	LC88FC2F0BUTJ-2H

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



信頼性データの要約:

QV デバイス名 LC88FC2F0BUTJ
RMS O47287 および O49812 パッケージ
TQFP 100

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/ 48 x3
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/48 x3
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	1000 cyc	0/77 x3
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	NA	NA
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77 x3
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C		0/170 x3
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/10 x3
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/15 x3

電気特性の要約:

電気特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

部品番号	品質試験用ピークル
LC88FC2F0BUTJ-2H	LC88FC2F0BUTJ-2H



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
LC88FC2F0BUTJ-2H		LC88FC2F0BUTJ-2H